

Nidec

All for dreams

- 特征 -

1.高速检测：检测工时: 6.0秒/4面基板

- Tact time 6.0 sec. / 4 faced-substrate

2.L/UL一体化（节省空间）

- Integrated L/UL

3.综合定位精度 $\pm 7.5\mu\text{m}$

- Total alignment accuracy

4.分步 & 重复构造实现 高效检测

- Step & Repeat movement

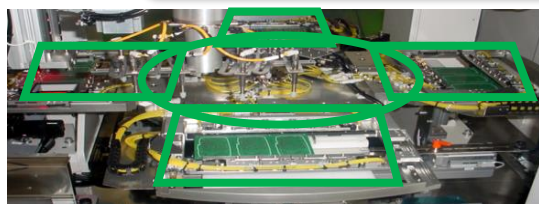
◎最适合检测智能手机和平板电脑用电路板、以及Mini LED基板◎

- Best test equipment for the substrate on smartphone and tablet PC and Mini LED!



高速检测: 检测工时

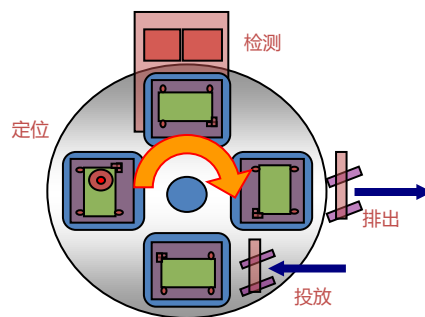
- Tact time 6.0 sec. / 4 faced-substrate



检测工时：**6.0秒/片** (4面基板)

▲ 旋转工作台

预计检测时间0.5秒/1面

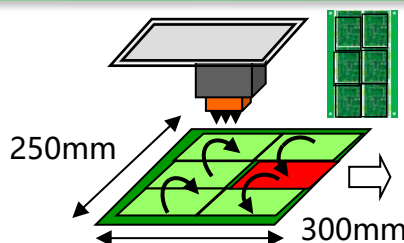


分步 & 重复构造实现 高效检测

- Step & Repeat movement

运用X、Y 分步 & 重复式构造
进行高效的检测

降低治具费用 = 压缩运营成本



ニデックアドバンステクノロジー株式会社

NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CORPORATION

<https://www.nidec.com/jp/nidec-advancetechnology/>

*Nidec-Read Corporation to be renamed
Nidec Advance Technology Corporation
from April in 2023.

■Headquarters : Nidec PARK Bldg. C, 1-1 Higashinokuchi,
Morimoto-cho, Muko-shi, Kyoto, 617-0003,
Japan

TEL : 075-315-8558 FAX : 075-315-8011

■Domestic office : Kyoto / Nagoya / Tokyo

■Global office : Taiwan, China / Korea / China / Thai / Canada **More details...**

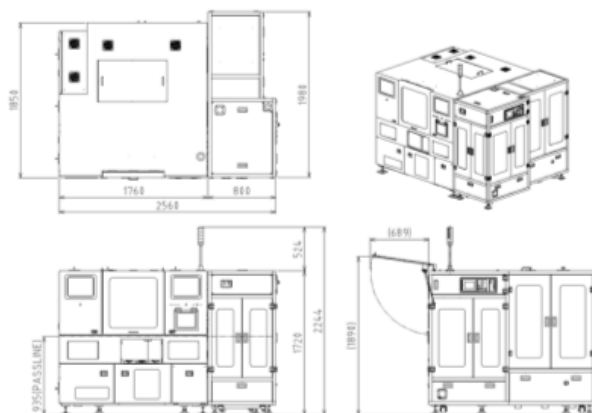


型号名	SREC® M6IISW-16K	SREC® M6IISW-32K
电路板尺寸/厚度 检测范围	最小 W60×D50mm ~ 最大 W300×D250mm / 0.3mm ~ 2.0mm 最小 W54×D38mm ~ 最大 W294×D238mm	
检测构造	由4旋转台形成的分步&重复式构造 (Index)	
对位 / 精度	双面CCD自动定位 重复精度 ±5.0μm 综合对位精度 ±7.5μm	
台面	通用夹持机构	
检测项目	导通 (OPEN) 1Ω ~ 100kΩ(DC1V ~ 250V) 搭载高速测试仪R-5920时 短路 (LEAK) 10kΩ ~ 1000MΩ(DC10V ~ 250V) / 检测选项	
最大检测点	D/D Scanner: 8192pins (U4096 + L4096p) Q/D Scanner: 16384pins (U8192 + L8192p)	max 32768pins (upper16384 pins+ Lower16384Pins)
治具型号	专用治具(探针式、TRL非接触式、橡胶式)	
治具尺寸	①M6 标准尺寸 ②M6 通用治具尺寸(Changed by Universal Adapter) ③M6SW 特殊尺寸(最大尺寸W290×D200mm ※有限制) ④最小治具尺寸 40×40mm	
治具交换	一键取出	
产出量 (Case Study)	6秒/4pcs (OPEN: 100Ω/100V LEAK: 100MΩ/250V) 状态: 1,500 点×4pcs S&R, 1套治具, 无检测选项 < 与现有产品相比 > S-REC V5 < 检测相同的基板时 > 13秒/4pcs OPEN: 100Ω/100V LEAK: 100MΩ/100V 状态: 6,000 点/片 1个压合基准, 无检测选项)	
堆料处	投放, OPEN, LEAK, PASS, (Slip Sheet for PP搬送型) / 电梯式堆料	
尺寸/重量	外形尺寸: W2,560×D1,980×H1,720mm 重量: 3,500kg	
测试仪选配	4端子检测, HR μ微短路检测, 火花检测功能 (专利), 消除接触电阻构造(专利), TRL 非接触式检测(专利), 嵌入式LCR检测	
设备选配	1,不良品镭射打印; 2,维码读取功能; 3,隔纸功能 (上料x2stacker/下料x4stacker, 适用于Mini LED基板测试)	

Dimension:

(Approx.)

W2,560×D1,980×H1,720mm



※上述规格发生变化时, 若未提前通知, 敬请谅解!

ニデックアドバンステクノロジー株式会社

■Headquarters : Nidec PARK Bldg. C, 1-1 Higashinokuchi,
Morimoto-cho, Muko-shi, Kyoto, 617-0003,
Japan

NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CORPORATION

<https://www.nidec.com/jp/nidec-advancetechnology/>

TEL : 075-315-8558 FAX : 075-315-8011

*Nidec-Read Corporation to be renamed
Nidec Advance Technology Corporation
from April in 2023.

■Domestic office : Kyoto / Nagoya / Tokyo

■Global office : Taiwan, China / Korea / China / Thai / Canada **More details...**